



Рентгеновский дифрактометр XRD-7000

Производитель: Shimadzu Corporation

Модель: XRD-7000

<https://assa-group.ru/-entgenovskiy-difraktometr-xrd-7000>

Дифрактометр

- Высокопрецизионный вертикальный θ - θ гониометр, разработанный для работы с образцами большого размера до 400мм(Ш) x 550мм(Г) x 400мм (В) максимум.
- Большой R- θ столик для образцов диаметром до 350мм и высотой 190мм (опция).
- Автоматическое картирование напряжения.
- Система поликапиллярной оптики, обеспечивающая параллельный рентгеновский пучок и принципиальное улучшение соотношения пик/фон (опция).

Позиция	Наименование	XRD-7000, 2 кВ	XRD-7000, 3 кВ
Рентгеновская трубка	Материал анода	Cu, Mo, Co, Fe, Cr, W на выбор, нормальный фокус	Cu, Mo, Co, Fe, Cr на выбор, широкий или линейный фокус
	Размеры фокуса	1,0*10 мм	2,0* 12 мм 0,4*12 мм
	Максимальная	2 кВ	3 кВ

Рентгеновский генератор	мощность	
	Максимальная мощность	3 кВ
	Максимальные параметры работы	60 кВ - 80 мА
	Защита трубки	Защита от превышения мощности, перегрузок по току и напряжению
Гониометр	Механизм защиты	Механизм блокировки двери Аварийный стоп
	Тип	Вертикальный Θ - Θ
	Радиус Гониометра	275 мм стандартный (может меняться от 200 до 275 мм
	Размеры образца максимальные	400мм *550 мм* 400 мм
	Диапазон углов сканирования	от -12 до 164°(2 Θ), от -6 до +82° (Θ_s); -6°до +132°(Θ_d)
	Автосамплер	5 позиций (опция)
	Минимальный шаг сканирования	0, 0002° (2 Θ) ; 0,0001° (Θ)
	Режимы работы	Непрерывное сканирование, пошаговое сканирование, калибровка, позиционирование, осцилляция по оси Θ
	Скорость сканирования	0,1°-50°/ мин (Θ_s , Θ_d); 0,1°-100°/ мин (2 Θ)
	Сцинтилляцион	Кристалл NaI

Детекторный счетчик (на выбор)		Время измерения шага 0,1~1000 сек Линейная скорость счета 100000 имп/сек
	Высокоскоростной широкоугольный детектор	Количество каналов 1280 Область регистрации 64x8мм
Дополнительные принадлежности (опции)	Система поликапиллярной оптики Система автоматически меняющихся щелей Противомонохроматор Приставка для анализа тонких пленок Приставка для анализа волокон с программным обеспечением Приставка для анализа микрообъектов с цифровой видеокамерой Приставка для анализа напряжений с программным обеспечением Высоко- и низкотемпературные камеры Приставка для текстурного анализа с программным обеспечением	
Дополнительное программное обеспечение (опция)	Расчет остаточного аустенита Расчет прецизионных параметров решетки Определение типа кристаллической решетки Определение кристаллитов и искажений решетки Определение степени кристалличности База данных порошковых дифрактограмм <i>ICDD</i> Анализ <i>Rietveld</i>	

<https://assa-group.ru/-entgenovskiy-difraktometr-xrd-7000>

Подберем

оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.